Se	arch	Note:	S

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination
10/539,693	HAACKE ET AL.
Examiner	Art Unit
Joseph L. Williams	2879

SEARCHED			
	SEAN	CHED	
Class	Subclass	Date	Examiner
313	568 570 573 572 634 637	1/4/2007	JW
	,		
			:

INTERFERENCE SEARCHED				
Class	Subclass	Date	Examiner	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
	L			

(INCLUI	-Anon	STRATEGY	<u>, </u>
	 	DATE	EXMR
None		1/7/2007	WL
·			
	·		